文章编号:1000-7032(2016)01-0094-06

# 纳米银焊膏封装大功率 COB LED 模块的性能研究

杨呈祥<sup>1</sup>,李 欣<sup>1\*</sup>,孔亚飞<sup>1</sup>,梅云辉<sup>1</sup>,陆国权<sup>1,2</sup> (1. 天津大学 材料科学与工程学院,天津 300072; 2. 弗吉尼亚理工大学 材料科学与工程学院,弗吉尼亚 蒙哥马利 24060)

**摘要:**为提高大功率 LED 的散热能力,采用具有更高熔点和更优良的导电导热性能的纳米银焊膏作为芯片 粘结材料,以 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 基陶瓷基板封装 COB LED 模块。同时以 Sn/Ag3.0/Cu0.5 和导电银胶两种粘结材料作为 对比,分别在 27,50,80,100,120 ℃等环境温度中测试 3 种模块的光电性能来评估模块的热管理水平;在 100 ℃环境下进行加速老化实验,评估 3 种 LED 模块的可靠性。测试结果表明,纳米银焊膏封装的大功率 LED 模 块光电性能优异,且具有较强的长期可靠性。

**关 键 词:**大功率 LED; COB 封装;纳米银焊膏;光电性能;可靠性 **中图分类号:**TN312.8 **文献标识码:** A **DOI**: 10.3788/fgxb20163701.0094

### High Power COB LED Modules Attached by Nanosilver Paste

YANG Cheng-xiang<sup>1</sup>, LI Xin<sup>1\*</sup>, KONG Ya-fei<sup>1</sup>, MEI Yun-hui<sup>1</sup>, LU Guo-quan<sup>1,2</sup>

 School of Material Science and Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China;
 Department of Material Science and Engineering, Virginia Tech, Montgomery 24060, America) \* Corresponding Author, E-mail; xinli@tju.edu.cn

Abstract: In order to improve the thermal performance of the high-power LED, the novel nanosilver paste with higher melting temperature and thermal/electrical conductivity was used as die-attach material, and  $Al_2O_3$ -based ceramic substrates were used to form a high-power LED chip-on-board (COB) architecture. To compare the effect of die attach material, high power COB LED modules were packaged by nanosilver paste, traditional Sn/Ag3. 0/Cu0. 5 solder and silver epoxy, respectively. The photoelectricity properties of three kinds of LEDs under various ambient temperatures from 27 to 120 °C were measured to evaluate their thermal management. The accelerated degradation testing under 100 °C was measured to evaluate the reliability. The test results show that the nanosilver paste is a very promising die-attach material for high power multi-chip modules packaging.

Key words: high power LED; COB packaging; nanosilver paste; photoelectricity property; reliability

1引言

随着 LED 应用市场的逐渐成熟,人们对大 功率 LED 的需求越来越多。光通量是体现 LED 竞争能力的关键参数<sup>[1]</sup>。人们采用多芯片集成 阵列模块的方法<sup>[2]</sup>使 LED 的光输出能力逐年增 强,同时 LED 的功率和正向电流也逐渐增大。 这直接导致 LED 结温的升高,而结温升高会使

收稿日期: 2015-09-10;修订日期: 2015-11-12

基金项目:天津市自然科学基金青年基金(13JCQNJC02400)资助项目

LED 的量子效率降低,寿命缩短,输出波长红移 甚至器件失效<sup>[3-7]</sup>。因此,LED 模块的散热能力 对于 LED 可靠性的影响非常大。近年来,人们 对环境保护和可持续发展的意识越来越强,因 此如何在提高 LED 输出功率的同时尽可能减小 封装体积以减少封装成本和能量浪费,成为一 个重要课题。

作为一级封装,芯片粘结层是热量由芯片传 输到基板的必经路径,因此粘结层材料是影响大 功率 LED 散热能力及可靠性的主要因素<sup>[8]</sup>。常 用的粘结材料有锡基焊料<sup>[9]</sup>和导电银胶<sup>[10]</sup>。但 由于这两种粘结材料失效温度较低,所以工作温 度受到限制,满足不了大功率 LED 应用于军工行 业、航空航天和核环境等高温恶劣环境<sup>[10]</sup>的需 要。纳米银焊膏由于能够实现低温烧结且烧结完 成后为多孔单质银层,可以应用于高温环境且具 有优良的热学、电学、力学性能和可靠性,因此在 恶劣环境应用的高功率 LED 模块封装中具有一 定的潜力。

COB(Chip-on-board)封装技术可通过基板直接散热,减少热阻,适合于大功率多芯片阵列的 LED 电子封装<sup>[11-12]</sup>。本文采用纳米银焊膏代替 传统的粘结材料,用于高功率 COB LED 模块的芯 片级粘结。为了研究恶劣环境中模块的工作性 能,分别在不同温度条件下测试纳米银焊膏封装 模块的光电特性,并将其与 Sn/Ag3.0/Cu0.5 和 导电银胶封装模块进行对比,研究芯片级粘结材 料对大功率 LED 模块性能的影响。

#### 2 实 验

#### 2.1 实验材料

本实验采用 OSRAM 的 F4152A 型 GaN 基大 功率蓝光1W芯片作为实验对象。如图1(a)所 示,芯片为垂直式 LED,N极向上,上下两电极均 采用镀金处理。芯片尺寸为1mm×1mm×0.19 mm(图1(b))。采用 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 基 DPC 陶瓷基板作 为大功率 LED 支架,表面覆银,如图2所示。基 板尺寸为12mm×12mm×0.5mm,基板上9个 独立焊盘可完成9芯片集成。

新型高温用纳米银焊膏由美国 NBE 公司 (NBE Technologies LLC, Blacksburg, VA)提供, 含银量为80%,银颗粒平均粒径约为30 nm,热导 率为238 W/(m・K)。为了研究不同粘结材料对 LED 模块性能的影响,另外采用针筒式 LF-200 型 Sn/Ag3. 0/Cu0. 5 合金 焊料和 Ablebond 84-1LMISR4 型导电银胶封装 LED 模块并进行对比。



- 图 1 (a) OSRAM 1 W 蓝光芯片示意图;(b) 芯片尺寸 示意图。
- Fig. 1 (a) Schematic of OSRAM 1 W LED blue chip. (b) Schematic of chip size.





#### 2.2 样品制备

本实验制备 LED 模块的过程如图 3 所示。 基板经过清理后,采用点胶的形式将纳米银焊膏 涂覆于基板上,而后完成贴片。将粘结好芯片的 模块置于加热台上,在280 ℃下完成焊膏烧结,并 通过金线键合实现芯片与基板间的电气连接。金 线键合采用三串三并的电路形式,如图 4 所示。 本实验中,用于对比的 Sn/Ag3.0/Cu0.5 合金焊 料和导电银胶的工艺曲线如图 5 所示。



图 3 9 W COB 封装的 LED 模块制备流程 Fig. 3 Preparation of 9 W COB LED modules



图 4 LED 模块三串三并电路 Fig. 4 Simplifed electrical circuit of LED module



- 图 5 粘结工艺曲线。(a) Sn/Ag3.0/Cu0.5;(b) 导电 银胶。
- Fig. 5 Sintering process. (a) Sn/Ag3.0/Cu0.5.(b) Silver epoxy.

#### 2.3 实验方法

针对制备完成的样品,分别进行光电性能和

可靠性测试。图6所示为本实验采用的光电测试 系统示意图。在实验中,将样品置于积分球中,给 LED模块通直流电,电流从0~1500mA不断增 加,每隔100mA记录样品光电测试数值,获得 LED模块光电特性随电流的变化关系,每组测试 3个样品取平均值。为了研究不同环境温度对模 块性能的影响,采用加热片分别为实验提供50, 80,100,120℃的高温环境。





为了研究不同粘结材料对 LED 模块长期可 靠性的影响,采用如图 7 所示的光衰测试系统进 行 100 ℃环境下的加速老化实验,记录 3 种模块 长时间点亮的光性能变化。





Fig. 7 Luminous flux degradation testing system

#### 3 结果与讨论

## 3.1 纳米银焊膏封装大功率 COB LED 模块的 光电性能

图 8 为纳米银焊膏粘结的 LED 模块在 27, 50,80,100,120 ℃环境温度下的光功率随电流的 变化关系。由图可以看出,在小电流区域,光功率 与电流基本呈线性关系;随着电流的进一步增大, 光功率增长速率逐渐减缓。这是 LED 芯片内部 PN 结处热量积累的结果。

此外,还可以看出,在较高的环境温度下,相同电流对应的光功率较低。当电流为1500 mA时,50,80,100,120 ℃环境下的 LED 模块光功率 分别比室温下点亮模块的光功率下降3.3%、 17.6%、22.7%、25.7%。这是由于高温导致电子 与空穴复合受阻<sup>[12]</sup>。



图 8 不同温度下的光功率-电流关系曲线



图9给出了纳米银焊膏封装的 LED 模块在 不同点亮电流下,发光波长与温度的变化关系。 可以看出,当点亮电流一定时,模块的发光波长随 温度的变化出现红移。将波长随温度的变化数据 进行线性拟合,可以看出各电流下的波长温度系 数几乎一致,经计算可以得到纳米银焊膏封装 COB LED 模块的波长温度系数为0.05 nm/℃。







# 3.2 芯片粘接材料对大功率 COB LED 模块光 电性能的影响

为了研究芯片级粘接材料纳米银焊膏、Sn/Ag3.0/Cu0.5 焊料以及导电银胶对封装模块光电性能的影响,我们分别测试了各模块在不同工作环境中的发光效率,结果如图10所示。从图中可以看出,在各个环境温度下,纳米银焊膏封装的LED模块的光效率均明显高于Sn/Ag3.0/Cu0.5 焊料和导电银胶。此外,对于所有的LED模块, 其光效率均随电流水平的提高而降低。这种现象 与势阱中的电子数量有关。当电子处在势阱中 时,其势能最小,数量比较稳定。但随着电流的增 加,注入势阱的电子数量逐渐增多,与此同时,越 来越多的电子扩散逸出势阱,产生无辐射的电子



图 10 不同环境温度下的 LED 器件的光效率-电流关系 曲线。(a) 27 ℃; (b) 50 ℃; (c) 80 ℃; (d) 100 ℃。

Fig. 10 Plots of calculated luminous efficiency vs. current for LED modules at various ambient temperatures.
(a) 27 °C. (b) 50 °C. (c) 80 °C. (d) 100 °C.

与空穴复合,导致内部量子效率的降低,从而引起 光效率的下降<sup>[13-14]</sup>。

此外,从图 10 中4 组环境温度下的模块光效 率对比可以看出,环境温度越高,纳米银焊膏封装 模块的光效率优势越明显。在此,我们分别计算 了当电流注入水平为1 500 mA 时,各温度下 Sn/ Ag3.0/Cu0.5 焊料和导电银胶封装的 LED 模块 的光效率较纳米银焊膏封装模块的降低率,计算 结果见表1。在高温环境中纳米银焊膏的优势之 所以愈加明显,是由于其具有更强的疏散内部热 量的能力。在3种芯片粘接材料中,纳米银焊膏 的热传导能力最强,因此相比于另外两组 LED 模 块,由纳米银焊膏粘接的模块可以更有效地向外 疏散内部热量,且在高温环境下差别更加显著。

- 表1 1 500 mA 电流水平下的 Sn/Ag3.0/Cu0.5 焊料和 导电银胶封装的 LED 模块光效率较纳米银焊膏封 装模块的降低率
- Tab. 1 Lumen degradation for modules die attached by Sn/ Ag3. 0/Cu0. 5 and silver epoxy relative to the ones die attached by nanosilver paste under 1 500 mA

材料/℃	锡银铜焊料/%	导电银胶/%
27	1.8	5.5
50	1.9	7.2
80	3.3	8.0
100	5.5	8.8

### 3.3 芯片粘接材料对大功率 COB LED 模块可 靠性的影响

在1000 mA 电流水平下,我们对纳米银焊 膏、Sn/Ag3.0/Cu0.5 焊料和导电银胶封装的 LED 模块进行了100 ℃的加速老化实验,研究不同粘 结材料对其长期可靠性的影响。图11 中给出了 3 种材料粘结的 LED 模块的光衰曲线。从图中可 以看出,3 种材料封装的 LED 模块的光输出均在





短暂升高后逐渐降低,且纳米银焊膏封装的 LED 模块下降较其他两种材料平缓。当实验进行至 1 000 h时,纳米银焊膏、Sn/Ag3.0/Cu0.5 焊料和 导电银胶封装的 LED 模块的光通量分别下降至 初始的 91.5%、87.5%、87%,说明纳米银焊膏封 装的大功率 LED 模块具有更优异的长期点亮可 靠性。

#### 4 结 论

采用新型的纳米银焊膏作为芯片粘结材料封 装高功率 COB LED 模块,其主波长变化(Δλ)与 周围温度 T 呈线性关系,波长温度系数为 0.05 nm/℃。与锡银铜焊料、导电银胶相比,纳米银焊 膏封装的 LED 模块表现出最优的光效率值,其不 同环境温度下光效率均高于前两者,并且这种差 值随温度的增加更加显著;纳米银焊膏封装 LED 模块的光衰减率比前两者明显偏低,具有更优异 的长期点亮可靠性。这些显著性差异主要是由于 纳米银焊膏粘结层具有较高的导电导热率,其封 装的高功率 LED 器件可以更有效地将 PN 结处产 生的热量转移到外界环境,降低结温,进而增强器 件性能及延长器件寿命。

#### 参考文 献:

[1] 宁磊,史永盛,史耀华,等. LED 封装结构对出光率的影响 [J]. 液晶与显示, 2010, 25(6):822-825.
 NING L, SHI Y S, SHI Y H, et al.. Influence of package structure on LED light extraction [J]. Chin. J. Liq. Cryst. Disp., 2010, 25(6):822-825. (in Chinese)

[2] 白一鸣,罗毅,韩彦军,等.集成封装发光二极管光提取效率的计算及优化 [J]. 光学 精密工程, 2014, 22(5): 1129-1137.

BAI Y M, LUO Y, HAN Y J, *et al.*. Calculation and optimization of light extraction efficiency for integrated LED [J]. *Opt. Precision Eng.*, 2014, 22(5):1129-1137. (in Chinese)

- [3] NARENDRAN N, GU Y. Life of LED-based white light sources [J]. J. Disp. Technol., 2005, 1(1):167-171.
- [4] NARENDRAN N, GU Y, FREYSSINIERJ P, et al. Solid-state lighting: failure analysis of white LEDs [J]. J. Cryst. Growth, 2004, 268(3):449-456.
- [5] ARIK M, BECKER C A, WEAVERS E, et al. Evaluation of temperature distribution of LED module [J]. Microelectron. Reliab., 2013, 53(4):554-559.
- [6] NARENDRAN N, GU Y, HOSSEINZADEH R. The degradation of GaAlAs red light-emitting diodes under continuous and low-speed pulse operation [J]. Microelectron. Reliab., 1998, 38(10):1627-1630.
- [7] 王志斌,刘永成,李志全. 双进双出射流水冷大功率 LED 散热系统研究 [J]. 光子学报, 2014, 43(7):0723003-1-6.

WANG Z B, LIU Y C, LI Z Q. Analysis on high power LED cooling system based on double inlet and outlet water jet [J]. Acta Photon. Sinica, 2014, 43(7):0723003-1-6. (in Chinese)

- [8] LI X, CHEN X, LU G Q. Reliability of high-power light emitting diode attached with different thermal interface materials [J]. J. Electron. Pack., 2010, 132(3):031011-1-6.
- [9] MANIKAM V R, CHEONG K Y. Die attach materials for high temperature applications: a review [J]. IEEE Trans. Compon. Pack. Manufact. Technol., 2011, 1(4):457-478.
- [10] RIMDUSIT S, ISHIDA H. Development of new class of electronic packaging materials based on ternary systems of benzoxazine, epoxy, and phenolic resins [J]. Polymer, 2000, 41(22):7941-7949.
- [11] 兰海,邓种华,刘著光,等. LED 的 COB 封装热仿真设计 [J]. 发光学报, 2012, 33(5):535-539. LAN H, DENG Z H, LIU Z G, et al. Thermal simulation for design of LED COB package [J]. Chin. J. Lumin., 2012, 33(5):535-539. (in Chinese)
- [12] 马建设, 贺丽云, 刘形, 等. 板上芯片集成封装的发光二极管结构设计 [J]. 光学 精密工程, 2013, 21(4):904-910. MAJS, HELY, LIUT, et al. Design of optical structure for chip-on-board wafer level packaging LEDs [J]. Opt. Precision Eng., 2013, 21(4):904-910. (in Chinese)
- [13] 王健,黄先,刘丽,等. 温度和电流对白光 LED 发光效率的影响 [J]. 发光学报, 2008, 29(2):358-362. WANG J, HUANG X, LIU L, et al. Effect of temperature and current on LED luminous efficiency [J]. Chin. J. Lumin., 2008, 29(2):358-362. (in Chinese)
- [14] 郑峰, 刘丽莹, 刘小溪, 等. 多主色 LED 照明光源的相关色温调控 [J]. 光学 精密工程, 2015, 23(4):927-933. ZHENG F, LIU L Y, LIU X X, et al. . Control of correlated color temperature for multi-primary color LED illumination [J]. Opt. Precision Eng., 2015, 23(4):927-933. (in Chinese)



杨呈祥(1990-),男,山西太原人, 硕士研究生,2012年于长春理工大 学获得学士学位,主要从事纳米银 焊膏的低温烧结及性能测试方面的 研究。

E-mail: aeiq560@163.com



李欣(1984-), 女, 天津人, 博士, 2012 年于天津大学获得博士学位,主要从 事高功率电子封装技术以及可靠性方 面的研究。 E-mail: xinli@tju.edu.cn